

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 3 区分
 【発行日】平成 19 年 4 月 5 日 (2007.4.5)

【公開番号】特開 2000-324314 (P2000-324314A)
 【公開日】平成 12 年 11 月 24 日 (2000.11.24)
 【出願番号】特願 2000-45616 (P2000-45616)
 【国際特許分類】

H 0 4 N **1/19** **(2006.01)**
G 0 1 B **11/30** **(2006.01)**
G 0 1 N **21/958** **(2006.01)**
G 0 3 B **27/46** **(2006.01)**
G 0 1 B **11/24** **(2006.01)**
H 0 4 N **1/40** **(2006.01)**

【F I】

H 0 4 N 1/04 1 0 3 E
 G 0 1 B 11/30 A
 G 0 1 N 21/958
 G 0 3 B 27/46
 G 0 1 B 11/24 K
 H 0 4 N 1/40 1 0 1 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 2 月 20 日 (2007.2.20)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

画像から少なくとも 1 つの表面欠陥の影響を取り除く装置であって、
 少なくとも 1 つの可視光源と、
 少なくとも 1 つの赤外線光源と、
画像から光線を受け、信号を生成する少なくとも 1 つのセンサーと、
前記信号を処理し、可視光画像及び赤外線光画像を生成し、赤外線光画像上の各表面欠陥の影響を区別し、各表面欠陥の影響に、可視光の大きさについての第 1 関数を掛け算して、積を生成し、生成された積を可視光画像から取り除く少なくとも 1 つのコンピュータ装置、
 を含む装置。

【請求項 2】

コンピュータ装置はさらに、表面欠陥の影響が無い赤外線光画像の範囲内にある赤外線光画像の大きさに一致する大きさを、赤外線光画像から引き算する要素を有する、請求項 1 の装置。

【請求項 3】

コンピュータ装置はさらに、空間周波数定義域において表面欠陥の影響を分離する要素を含む、請求項 1 から 2 の何れかの装置。

【請求項 4】

コンピュータ装置はさらに、表面欠陥の影響に可視光の大きさの第 1 関数を掛け算して積を生成し、

表面欠陥の影響に、上限関数よりも小さい可視光の大きさの下限関数を掛け算して、積を生成し、

可視光画像から、上限積と下限積の混合を取り除く要素を含む、請求項 1 から 3 の何れかの装置。

【請求項 5】

画像走査から少なくとも 1 つの表面欠陥の影響を取り除く方法であって、

(a) 画像から可視光を受けて可視光画像を生成し、

(b) 画像から赤外線光を受けて赤外線光画像を生成し、

(c) 赤外線光画像上の表面欠陥の影響を識別し、

(d) 表面欠陥の影響に、可視光の大きさについての第 1 関数を掛け算して、積を生成し

(e) 工程(d)の積を可視光画像から取り除くこと、を含む方法。

【請求項 6】

工程(c)は、表面欠陥の影響が無い赤外線光画像の範囲内にある赤外線光画像の大きさと一致する大きさを、赤外線光画像から引き算することによって達成される、請求項 5 の方法。

【請求項 7】

画像からの可視光は画像から反射した光である、請求項 5 から 6 の何れかの方法。

【請求項 8】

工程(d)は、該影響に対して、可視光の大きさの上限関数を掛け算して、上限の積を生成し、また該影響に対して、上限関数よりも小さな可視光の大きさの下限関数を掛け算して、下限の積を生成することによって達成され、

工程(e)は、可視光画像から、上限の積と下限の積の混合を取り除くことによって達成される、

請求項 5 から 7 の何れかの方法。

【請求項 9】

工程(c)は、空間周波数定義域において表面欠陥の影響の各々を分離することによって達成される、

請求項 5 から 8 の何れかの方法。

【請求項 10】

処理を施した走査画像であって、請求項 5 から 9 の何れかの方法によって生成された走査画像。